



Invitation til gå-hjem-møde

Mikro- og nanostrukturerede overflader

26. november 2014 kl. 13:00 – 15:30

Hidtil har det været forbundet med store udfordringer at måle ruheder på nanoskala ($R_a < 50$ nm), karakterisere indersiden af en mørtik eller undersøge kvaliteten af svejsninger på svært tilgængelige områder. Med nye karakteriseringsmetoder er alt dette muligt og endda uden at det kræver store investeringer!

Danmarks Nationale Metrologiinstitut, DFM og FORCE Technology indbyder til gå-hjem-møde, hvor du kan høre om resultaterne opnået indenfor aktiviteten "Mikro- og nanostrukturerede overflader" i innovationsnetværket PlastNet. I projektet har der været særligt fokus på analyse af svært tilgængelige områder ved hjælp af replikering, der er en billig metode til at muliggøre karakterisering af disse områder. Desuden er der arbejdet med areal-baseret (3D) ruhedsmåling, der giver et langt mere detaljeret billede af en ukendt overflade.

Agenda

- 3D karakterisering af overflader
- Avanceret ruhedsanalyse
- Eksempler på replikering på svært tilgængelige områder
- Demonstration af replikering med en usikkerhed på under 0.2 %
- Åben diskussion med kaffe og kage

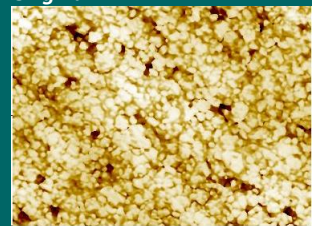
Praktisk info

Dato: 26. november 2014
Tidspunkt: 13:00 – 15:30
Hvor: FORCE Technology, Navervej 1, 6600 Vejen
Tilmelding: Senest 25. november 2014 til info@dfm.dk
Mødet er gratis for medlemmer af PlastNet.
Tilmelding udbedes af hensyn til traktementet.

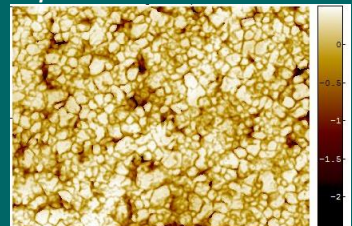
Eksempler på replika tests

Materiale: Cold-rolled steel

Original



Replika



Program

13.00 - 13.10 Registrering og kaffe

13.10 - 13.15 Velkomst og introduktion til PlastNet og FORCE Vejen
Specialist Marianne Strange, FORCE Technology

13.15 - 13.35 Motivation for replikering og problemstillinger
Forsker Kai Dirscherl, DFM

13.35 - 14.00 Praktisk anvendelse af replikamaterialer
Specialist Henrik Bang, FORCE Technology

14:00 – 14:15 Kaffe og kage

14:15 – 14:35 Evaluering af kvalitet af replikeringer
Forsker Morten Hannibal Madsen, DFM

14:35 – 14:55 Avancerede Mikroskop-teknikker til 3 Dimensionel Overfladekarakterisering
Specialist Thomas Fich Pedersen, FORCE Technology

14.55 - 15.15 Retningslinjer for nøjagtige replikeringer
Forsker Hannibal Madsen, DFM

15.15 - 15.30 Åben diskussion

Mødearrangør: DFM og FORCE Technology i samarbejde med Højteknologifondsprojektet NanoPlast, resultatkontraktprojektet "Dokumentation af mikro- og nanostrukturerede produkter", Innovationskonsortiet LIQCOP, samt Innovationsnetværket PlastNet.

Mødesprog: Dansk

Afbud: Seneste rettidige afbud er søndag, den 23. november 2014.

Pris: Temadagen er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Der beregnes et gebyr for udeblivelse eller for sent afbud på DKK 500,00 + moms.